

Установки для проверки электрической безопасности



GPT-712004
(установка пробояная
универсальная/ УПУ)

Установки комплексные для измерения параметров безопасности электрооборудования GPT-712001, GPT-712002, GPT-712003, GPT-712004 GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.

- Макс. функциональность «5 в 1»: AC/ DC/ IR/ GB/ GC (для GPT-712004)
- Выходная мощность 200 ВА, вых. усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности (КПД 90%) и надежности УПУ при тестировании
- Испытание переменным напряжением до 5 кВ, частота 50/60 Гц
- Высокое разрешение: 1 мкА - по току, 1 В – по напряжению
- Режим GC (I_{исп}100мА): измерение сопротивления цепей безопасности (заземления), контроль целостности защитных проводников (Continuity)
- Испытание постоянным напряжением до 6 кВ (кроме GPT-712001)
- Измерение сопротивления изоляции (только GPT-712003/ -712004 *)
- Измерение R низкоомных цепей током до 32А, разреш. 0,1 мОм (GPT- 712004)
- Установка ВВ напряжения при отключенной нагрузке, регулировка U_{исп} в ходе теста, МК-процессорное управление, высокая стабильность U_{исп}
- Испытания емкостной нагрузки (до 47 мкФ)
- Режимы запуска испытаний: «Ручной»/ «Авто», функция качания Sweep (график/ таблица), статистическая обработка результатов
- Тест по таймеру (заданное время - «Нарастание»/ «Спад»)
- Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста)
- Разъем «I/O» на передней панели для подключения аналоговых цепей удаленного управления (пуск, остановка, результат теста)
- Дублирование функционального выхода на задней панели
- Испытания с подключением установки к «земле» или изолирования от точки общего потенциала (GND – On/ Off)
- Память: 100 ячеек для записи профилей (10 блоков)
- Графический цветной TFT дисплей (диаг. 18 см)
- Интерфейс: RS-232, USB (2), опция: LAN
- Тест в соответствии с требованиями МЭК 61010-2-034

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ИСПЫТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ	Испытательное напряжение	0,05 кВ...5 кВ; частота 50/ 60 Гц (выбирается)
	Погрешность установки	± (1 % + 5 В), для U _{исп} ≥ 50 В (без нагрузки)
	Разрешение	1 В
	Диапазон установки тока	0,001 мА...40 мА (для U _{исп} ≤ 5 кВ); 0,001 мА...10 мА (для U _{исп} ≤ 0,5 кВ)
	Погрешность установки	± (1,5 % + 30 мкА)
	Макс. разрешение	1 мкА/ 10 мкА
	Макс. выходная мощность	200 ВА (5 кВ/ 40 мА)
ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (КРОМЕ GPT-712001)	Испытательное напряжение	0,05 кВ...6 кВ
	Погрешность установки	± (1 % + 5 В), для U _{исп} ≥ 50 В (без нагрузки)
	Разрешение	1 В
	Диапазон установки тока	0,001 мА...10 мА
	Погрешность установки	± (1,5 % + 3 мкА) для I < 1 мА, ± (1,5 % + 30 мкА) для I ≥ 1 мА
	Макс. разрешение	0,1 мкА/ 1мкА/ 10 мкА
	Макс. выходная мощность	50 Вт (5 кВ/ 10 мА)
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ IR (GPT-712003/ -712004)	Тестовое напряжение	50 ...1200 В, постоянное (разрешение 50 В)*
	Погрешность установки	± (1 % + 5 В)
	Диапазон измерений	0,1 МОм...50 ГОм
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НИЗКООМНЫХ ЦЕПЕЙ СВ (GPT-712004)	Погрешность измерения	± 5 % (базовая)
	Тестовое напряжение	~8 В макс (XX), частота 50/60 Гц (4-х пр. схема)
	Тестовый ток	3 А...30 А
	Разрешение	0,01А
	Диапазон измерений	1мОм...650 мОм
ЦЕЛОСТНОСТЬ ЦЕПИ (GC)	Разрешение	0,1 мОм
	Погрешность измерений	± (1 % + 2 мОм)
	Диапазон измерений сопротивления	0,1 Ом ... 70 Ом
ДЕТЕКТОР ТОКОВ УТЕЧКИ (ARC DETECT)	Погрешность измерения	разрешение: 0,01 Ом
	Диапазон установки	±(10% + 2 Ом)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ (ACW/ DCW/ IR/ GB)	Диапазон установки	1...80 мА ACW
	Время испытания (таймер)	1...20 мА DCW
	Погрешность установки	0,1...999,9 с (Нараст/ Спад) или непрерывно (Off)
	Заддержка запуска	±1*10 ⁻⁴ + 20 мс
		0,0...999,9 с

Дисплей	Цветной графический TFT- дисплей (18 см)
Память	100 ячеек (запись/вызов - 10 профилей теста)
Напряжение питания	~100В...240В ± 10%, 50 / 60 Гц
Интерфейс	RS-232, USB (2 host/ device)
Потребляемая мощность	не более 400 ВА
Габаритные размеры, мм	GPT-712001/ 712002/ 712003: 380 x 148 x 436 GPT-712004: 380 x 148 x 454
Масса, кг	GPT-712001/ 712002/ 712003: 11 GPT-712004: 15
Комплект поставки	Комплект измерительных проводов (1- GHT-115), измерительный кабель для режима GB (1- GTL-215, для GPT-712004), соединительный кабель для терминала ДУ/ Remote (1-GHT-119), шнур питания (1).
Опции	Модуль интерфейс LAN (сменная карта) высоковольтный 2-х пр. пробник-щуп (1 к-т - GHT-205), высоковольтные изм. провода 2м типа «пистолет» с выдвижным электродом (1 к-т - GHT-113).

***-примечание:** В новых версиях FW установка GPT-712000-серии в режиме измерения изоляции (IR) поддерживает диапазон Уисп 0,05...5 кВ (с шагом 50В). Для номиналов Уисп 1200В... 5000В погрешность измерений составит ± 5%... ± 15% (в ОТ - не нормировано!).

Сопоставление функциональности с предыдущими сериями (варианты замен):

МОДЕЛЬ	РВЫХ	Испытание перем. напряжением (ACW)	Испытание пост. напряжением (DCW)	Измерение R изоляции (IR)	Измерение R низкоомных цепей (GB)	Целостность цепи (GC)	Заменяемые модели	Ранее выпущенные модели
GPT-712001*	200 BA	√				√	GPT-79801	GPT-705A
GPT-712002*	200 BA	√	√			√	GPT-79802	GPT-715A
GPT-712003*	200 BA	√	√	√		√	GPT-79803	GPI-725A, GPI-735A
GPT-712004*	200 BA	√	√	√	√	√	GPT-79804	GPI-745A

*- Дополнительно встроен режим GC (Ground Check) - измерение сопротивления низкоомных цепей/ тест целостности током 100 мА.

Модели серии **GPT-712000** оснащены новой уникальной функцией развертки (**sweep**), которая отображает диаграмму кривой результатов испытаний исследуемого объекта (ИУ). Ведется поточечная запись (шаг за шагом) результатов измерений по итогам приложенного напряжения / тока и соответствующих настроек установки (например, начальное Уисп, время нарастания, продолжительность теста или время спада). После завершения теста, пользователи могут узнать количество приложенной энергии (напряжение / ток в конкретный момент теста) и результаты измерения, перемещая по графику курсор, т таким образом помогая оператору понять изменения и взаимозависимость измеренных параметров в ходе испытания (ток или сопротивление). Функция также может использоваться для локализации критических точек - провалов теста исследуемых объектов (пробоя). Ресурсы статистической обработки результатов измерений (**Statistics Function**) позволяют сразу оценить полученные данные для прогнозных оценок с целью повешения достоверности интерпретации итогов испытаний.

Особенность серии заключается в поддержке испытаний емкостной нагрузки (до **47 мкФ**). Это позволяет применять установки для тестирования ИУ с большой входной емкостью - импульсные источники питания, изделия бытовой техники и др. электронные устройства, использующие в выходных цепях сглаживающие фильтры для подавления НЧ шумов и пульсаций. Значение емкости в цепи зависит от конструкции конкретного ИУ. Как правило, представленные в настоящее время на рынке СИ тестеры электробезопасности (УПУ-5М и др.) имеют диапазон значений макс. ёмкости ИУ не более **5- 20 мкФ** (реж. Авто/ Ручной). В случае тестирования ИУ с емкостной компонентой в цепи измерений (режим испытания на пробой постоянным напряжением/ DCW) для корректности испытания необходимо учитывать первоначальный заряд конденсаторов в момент запуска теста. Процесс заряда в момент подачи нарастающего напряжения теста (даже при емкости ~1 мкФ) будет занимать дополнительное время, и в некоторых случаях длительность может превысить предел установки таймера (≥ 999с). Если заряд не будет завершен, то это повлияет на результат испытаний. Учитывая это (и в порядке обратной связи от пользователей) разработчики в моделях новой серии **GPT-712000** модернизировали выходные каскады и увеличили диапазон максимальной ёмкости в ИУ до 47 мкФ.

Ещё одной новацией реализованной в серии **GPT-712000** стала возможность установки времени задержки на следующий запуск испытаний (**Wait time**). Эта функция позволяет задавать временной интервал от старта испытаний до индикации в установке GPT информации об итогах теста. По умолчанию сообщение «Негоден»/ **FAIL** появляется через типовое контрольное время 0,3 секунды, однако для некоторых категорий ИУ может потребоваться больше времени для получения окончательного итога (с более стабильным результатом). Данная функция позволяет пользователю при необходимости самостоятельно регулировать этот параметр, чтобы учитывать конкретные испытательные приложения или специфику тестовой ситуации.